

СОДЕРЖАНИЕ

**ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ**

М. И. Киселев. Зачем нужна такая точность?	4
М. С. Хлыстунов, В. В. Подувальцев, Ж. Г. Могилюк. Проблемы до- стоверности и метрологический анализ спектральных фантомов цифро- вых технологий	8
Л. Н. Жерихина, Г. Н. Измайлов, А. Л. Карузский, А. В. Пересторо- нин, А. М. Цховребов. Измерение нелокальности магнитного возму- щения в сверхпроводящей щелевой линии	18
В. Г. Кутяйкин. Формы оценки соответствия технических средств для измерений и контроля	29

ИЗМЕРЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

В. А. Захаров, Т. Ю. Поздеева, А. Л. Невзоров. Ошибки информаци- онного обмена в цифровых каналах передачи информации измеритель- ных систем	36
---	----